

УДК 535.375.54+621.391.822.3

**РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
НЕРАВНОВЕСНОЙ СТОЛКНОВИТЕЛЬНОЙ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ПЛАЗМОЙ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ**

P. Баркаускас, С. В. Ганцевич, Р. Катилюс

Рассчитан спектр света, рассеянного электронно-дырочной плазмой полупроводника в условиях дрейфа носителей. В контролируемом столкновениями режиме, когда изменение волнового вектора света при рассеянии мало по сравнению с обратными длинами пробега электронов и дырок, дифференциальное сечение рассеяния света выражено через кинетические характеристики электронной и дырочной систем — коэффициенты диффузии, дрейфовые скорости и времена максвелловской релаксации. В случае многодолинного полупроводника показано, как на опыте в сечении рассеяния света разделить вклады от рассеяния на неэкранированной моде, обусловленной «флуктуациями масс», и на квазинейтральной моде, обусловленной амбиполярными флуктуациями плотности носителей.

Рассеяние электромагнитных волн носителями заряда в полупроводниках является чувствительным методом диагностики полупроводниковой плазмы [1-3]. До сих пор, однако, этим методом в основном исследовалось рассеяние света одним сортом носителей, причем чаще всего в бесстолкновительном режиме, когда электромагнитное поле рассеивают отдельные носители или/и плазмоны [1-3]. В электронно-дырочной плазме путем наблюдения рассеяния света удалось детектировать тепловую акустическую плазменную моду [4] — характерное для бесстолкновительной электронно-дырочной плазмы коллективное возбуждение.

Цель настоящей работы — рассчитать спектр рассеянного неравновесной электронно-дырочной плазмой света с учетом столкновений носителей заряда с решеткой. Основное внимание будет уделено предельному случаю частых столкновений, когда длина свободного пробега электронов и дырок мала по сравнению с обратной величиной изменения волнового вектора света при рассеянии. Наблюдение спектра света, рассеянного в таком «столкновительном» режиме носителями в *n*- и *p*-образцах [3, 5-10], дало большую и не всегда легко достижимую другими методами информацию о кинетических коэффициентах, временах междолинной релаксации и т. д. Мы надеемся, что проведенное в настоящей работе теоретическое исследование подтолкнет к постановке опытов по рассеянию света в столкновительном режиме также и в полупроводниках с двумя сортами носителей. Мы покажем, что, наблюдая форму линии рассеянного электронно-дырочной плазмой света, можно на опыте определить коэффициент амбиполярной диффузии, в том числе полный, т. е. с учетом конвективного амбиполярного вклада [11, 12], существенного в условиях дрейфа электронов и дырок. Мы также укажем геометрию опыта, при которой в многодолинном полупроводнике разделяются характерная для многодолинного полупроводника нейтральная мода («флуктуация масс») и амбиполярная мода. Кроме того, мы показываем, что при расчете столкновительного рассеяния света в многодолинном полупроводнике необходимо учесть вклад, обусловленный зависимостью вероятностей междолинных переходов от внутридолинного квазиймпульса.

1. Сечение рассеяния света

Рассмотрим однородный полупроводник со свободными электронами e и дырками h , к которому приложено создающее дрейф носителей и греющее их постоянное электрическое поле E . На полупроводник падает пучок света с волновым вектором k_s , вектором поляризации ϵ_s и частотой ω_s , лежащей в области прозрачности кристалла. Наблюдается рассеянный свет с волновым вектором k_r , поляризацией ϵ_r и частотой ω_r . Дифференциальное сечение рассеяния света многокомпонентной плазмой дается выражением [3, 13-15]

$$\frac{d\sigma}{d\Omega d\omega} = A v_0^2 \sum_{k j_k, r j_r} (1/m_k)_{j_k} (\delta n_{k j_k} \delta n_{r j_r})_{q\omega} (1/m_r)_{j_r}, \quad (1)$$

где $\omega = \omega_s - \omega_i$, $q = k_s - k_i$ — изменение частоты и волнового вектора света при рассеянии; j_k — номер долины в энергетической зоне носителей сорта k ($k=e, h$); далее $A \equiv (e^4/2\pi c^4)(\omega_s/\omega_i)^2$,

$$(1/m_k)_{j_k} \equiv (\epsilon_s (1/m_k)_{j_k} \epsilon_i) \quad (2)$$

— свертка тензора обратных эффективных масс в долине j_k с векторами ϵ_s и ϵ_i ; v_0 — объем рассеивающей области; $e_h = -e_e = e$ — элементарный заряд; $\delta n_{k j_k} = v_0^{-1} \sum_{p_{j_k}} \delta F_{k j_k p_{j_k}}$ — флуктуация концентрации носителей в долине j_k ; $\delta F_{k j_k p_{j_k}}$ — флуктуация функции распределения носителей. Квазимпульс отсчитывается от центра соответствующего эллипсоида.

С учетом столкновений с решеткой флуктуации заселенности долин и сечение рассеяния света на них в многодолинном полупроводнике с одним сортом носителей вычислялись в [15-17]. Обобщая результаты этих работ, для сечения рассеяния (1) нетрудно получить выражение

$$\frac{d\sigma}{d\Omega d\omega} = A 2 \operatorname{Re} \sum_{k j_k} \mu_{k j_k} \sum_{p_{j_k}} B_{k j_k p_{j_k}}^{-1} \mu_{k j_k}^* \bar{F}_{k j_k p_{j_k}}, \quad (3)$$

где

$$\mu_{k j_k} \equiv (1/m_k)_{j_k} - (e_k/\epsilon_{q\omega}) \sum_{r j_r} (1/m_r)_{j_r} \chi_{r j_r}^{q\omega} / e_r. \quad (4)$$

Здесь $\epsilon_{q\omega} = 1 + \sum_{r j_r} \chi_{r j_r}^{q\omega}$ — диэлектрическая проницаемость многокомпонентной плазмы вдоль направления q ,

$$\chi_{r j_r}^{q\omega} = -i U_q q \sum_{p_{j_r}} B_{r j_r p_{j_r}}^{-1} \partial \bar{F}_{r j_r p_{j_r}} / \partial p_{j_r} \quad (5)$$

— поляризуемость носителей сорта r в долине j_r ; $U_q = 4\pi e^2 / \sum_{\alpha\beta} q_\alpha q_\beta \epsilon_{\alpha\beta}^0 v_0$; $\epsilon_{\alpha\beta}^0$ — тензор диэлектрической проницаемости решетки. Оператор B определен следующим образом:

$$B_{k j_k p_{j_k}} \equiv -i\omega + i q v_{k j_k} + I_{k j_k p_{j_k}}, \quad (6)$$

где $v_{k j_k}$ — скорость носителя в состоянии p_{j_k} в долине j_k , обладающего энергией $\epsilon_{k j_k}(p_{j_k}) = (p_{j_k} (1/m_k)_{j_k} p_{j_k})/2$; $I_{k j_k p_{j_k}}$ — оператор релаксации многокомпонентной системы носителей

$$I_{k j_k p_{j_k}} \equiv \epsilon_k E \partial / \partial p_{j_k} + I_{k j_k p_{j_k}}^{th}, \quad (7)$$

где $I_{k j_k}^{th}$ — оператор, описывающий столкновения с решеткой — с примесями, дефектами, фононами и т. д. (как в работах [16, 17], так и в настоящей работе столкновениями между носителями пренебрегается; и электроны, и дырки считаются невырожденными). Функция \bar{F} в (3) —

это функция распределения носителей, удовлетворяющая стационарному кинетическому уравнению $I_{k j_k p_{j_k}} F_{k j_k p_{j_k}} = 0$. В термодинамическом равновесии $\partial F^{eq}/\partial p_{j_k} = -v_{kj_k} F^{eq}/T_0$, так что выражение (3) переходит в выражение

$$\frac{d\sigma}{d\vartheta d\omega} = A \frac{T_0}{U_q \omega} 2 \operatorname{Im} \left[\sum_{k j_k} \left(\frac{1}{m_k} \right)_{j_k}^2 \chi_{k j_k}^{q \omega} - \right. \\ \left. - \frac{1}{\epsilon_{q \omega}} \left(\sum_{k j_k} \frac{e}{e_k} \left(\frac{1}{m_k} \right)_{j_k} \chi_{k j_k}^{q \omega} \right)^2 \right], \quad (8)$$

являющееся обобщением на столкновительную электронно-дырочную плазму известной формулы Платцмана [13].

Наиболее интересен случай, когда междолинная релаксация происходит значительно медленнее, чем внутридолинная

$$\tau_{p_{j_k}} \ll \tau_{k j'_k j_k}, \quad (9)$$

где $\tau_{p_{j_k}}$ — характерное время внутридолинной релаксации в долине j_k ; $\tau_{k j'_k j_k}$ — среднее время ухода носителей из долины j_k в долину j'_k . В этом случае вид стационарного распределения носителей по импульсам внутри долины определяется только внутридолинными процессами и находится из «внутридолинного» кинетического уравнения

$$\mathcal{Q}_{k j_k p_{j_k}} f_{k j_k p_{j_k}} \equiv (e_k E \partial / \partial p_{j_k} + I_{k p_{j_k}}^{th}) f_{k j_k p_{j_k}} = 0. \quad (10)$$

Здесь средняя относительная заселенность состояния $f_{k j_k p_{j_k}} = F_{k j_k p_{j_k}} / \bar{N}_{k j_k}$, $\bar{N}_{k j_k} = \sum_{p_{j_k}} F_{k j_k p_{j_k}}$, $\sum_{j_k} \bar{N}_{k j_k} = \bar{N}_k$; $\bar{N}_{k j_k}$ — среднее число носителей в долине j_k , определяемое из системы уравнений

$$\sum_{j'_k \neq j_k} (\bar{N}_{k j_k} / \tau_{k j'_k j_k} - \bar{N}_{k j'_k} / \tau_{k j_k j'_k}) = 0, \\ 1 / \tau_{k j'_k j_k} = \sum_{p_{j_k}, p'_{j'_k}} W_{j'_k p'_{j'_k} j_k p_{j_k}}^{j_k p_{j_k}} \quad (11)$$

Здесь $W_{j'_k p'_{j'_k} j_k p_{j_k}}^{j_k p_{j_k}}$ — вероятность перехода носителя сорта k из состояния p_{j_k} в долине j_k в состояние $p'_{j'_k}$ в долине j'_k . Оператор междолинных переходов имеет вид

$$R_{j_k p_{j_k}} \psi_{j_k p_{j_k}} \equiv \sum_{p'_{j'_k}, j'_k \neq j_k} \left(W_{j'_k p'_{j'_k} j_k p_{j_k}}^{j_k p_{j_k}} - W_{j_k p_{j_k} j'_k p'_{j'_k}}^{j'_k p'_{j'_k}} \right), \quad (12)$$

оператор внутридолинного рассеяния дается таким же выражением, но без суммирования по долинам (т. е. $j'_k = j_k$).

Формулы (3), (5) сводят задачу нахождения сечения рассеяния электронно-дырочной плазмой к вычислению отклика носителей одного сорта на разного типа возмущения. Вычисление соответствующих откликов требует умения обращать оператор B , определенный в (6). В достаточно общем виде это удается сделать в предельных случаях коротких и длинных волн (больших и малых q). В случае электронно-дырочной плазмы до сих пор исследовался коротковолновый (бесстолкновительный) предел [1-8]. Рассеяние света на длинноволновых флуктуациях в многодолинном полупроводнике с одним сортом носителей рассматривалось в [17], однако при выводе алгоритма для вычисления отклика на длинноволновое

низкочастотное возмущение, т. е. при обрачивании оператора B там, как мы сейчас покажем, были допущены неточности. Поэтому повторим соответствующий вывод.

2. Отклик в многодолинном полупроводнике

Рассмотрим отклик системы носителей одного сорта в многодолинном полупроводнике. Соответственно в этом разделе вместо пары индексов $k_{j,k}$ будем писать один индекс j . Задача — решить уравнение $B_{j,p_j}x_{j,p_j}=y_{j,p_j}$, при условии редкости междолинных переходов (9), ограничившись областью малых q и ω , таких, что

$$qv_j\tau_{p_j} \ll 1, \quad \omega\tau_{p_j} \ll 1. \quad (13)$$

В этом «приближении внутридолинной гидродинамики», действуя так же, как в [17, 18], задачу нахождения «концентрационного» отклика $x_j = \sum_{p_j} x_{j,p_j}$ сведем к решению следующей системы алгебраических уравнений:

$$\hat{B}_j x_j \equiv b_j x_j - \sum_{j' \neq j} x_{j'}/\tau_{j,j'} = \hat{y}_j. \quad (14)$$

Здесь

$$b_j \equiv -i\omega + iqv_j + q^2 D_j + \sum_{j' \neq j} 1/\tau_{j',j}, \quad (15)$$

где

$$V_j = \sum_{p_j} v_j f_{j,p_j}, \quad D_{j,\alpha\beta} = \sum_{p_j} v_{j\alpha} \mathcal{J}_{j,p_j}^{-1} (v_{j\beta} - V_{j\beta}) f_{j,p_j} \quad (16)$$

— соответственно дрейфовая скорость носителей в долине j и тензор коэффициентов «внутридолинной» диффузии носителей. Роль эффективной возмущающей силы в (14) играет величина

$$\hat{y}_j \equiv \sum_{p_j} (y_{j,p_j} - iqv_j \mathcal{J}_{j,p_j}^{-1} \mathcal{L}_{j,p_j} - R_{j,p_j} \mathcal{J}_{j,p_j}^{-1} \mathcal{L}_{j,p_j}), \quad (17)$$

где $\mathcal{L}_{j,p_j} \equiv y_{j,p_j} - f_{j,p_j} \sum_{p_j} y_{j,p_j}$. Последнее слагаемое в правой части (17) описывает перераспределение носителей между долинами, происходящее в процессе быстрой внутридолинной релаксации возмущения и связанное с зависимостью скорости междолинных переходов от вида внутридолинных функций распределения. Этот эффект не был учтен в работе [17], между тем соответствующий вклад может быть сравним по величине с «токовым» вкладом — со вторым слагаемым в (17), — поскольку отношение третьего и второго слагаемых имеет порядок $(qv_j\tau_{j,j'})^{-1} = (qv_j\tau_{p_j})^{-1}\tau_{p_j}/\tau_{j,j'}$ и, вообще говоря, не мало. При вычислении поляризумостей (5) важны оба этих слагаемых. При этом $y_{j,p_j} = \partial F_{j,p_j}/\partial p_j$, т. е. $\sum_{p_j} y_{j,p_j} = 0$ — возмущение не «концентрационное», а чисто «силовое». В результате получаем

$$\chi_j^{q\omega} = \hat{B}_j^{-1} v_j, \quad (18)$$

где

$$v_j \equiv 1/\tau_j^M + iU_q q \sum_{j'} (\bar{N}_{j'} \partial \omega_{j',j} / \partial E - \bar{N}_{j'} \partial \omega_{j,j'} / \partial E) / e. \quad (19)$$

Здесь

$$1/\tau_j^M = -U_q q_\alpha q_\beta \bar{N}_j \sum_{p_j} v_{j\alpha} \mathcal{J}_{j,p_j}^{-1} \partial f_{j,p_j} / \partial p_{j\beta} \quad (20)$$

— обратное время максвелловской релаксации носителей j . Величина

$$\frac{\partial \omega_{j'j}}{\partial E} = -e \sum_{p_j, p_{j'}} W^{j p_j}_{j' p_{j'}} \sigma_{j p_j}^{-1} \frac{\partial f_{j p_j}}{\partial p_j} \quad (21)$$

описывает «междолинный токовый» вклад в отклик на полевое возмущение (т. е. влияние внутридолинных потоков на междолинные переходы). Аналогичная величина встречается в теории генерационно-рекомбинационных процессов [19], в теории генерационно-рекомбинационного шума [20]. Как видно из (21), величиной $\frac{\partial \omega_{j'j}}{\partial E}$ можно пренебречь, если вероятность ухода из долины $\sum_{p_j} W^{j p_j}_{j' p_j}$ слабо зависит от квазимпульса p_j носителя в долине.

Как видно из выражения (17), члены, содержащие $\frac{\partial \omega_{j'j}}{\partial E}$, возникают и при вычислении пространственно-однородного отклика ($q=0$), например, при вычислении малосигнальной электропроводимости многодолинного полупроводника.

3. Эквивалентные долины

Система уравнений (14) решается аналитически в важном случае эквивалентных долин, когда вероятности $W^{j p_j}_{j' p_j}$, в определении времен междолинных переходов (11) не зависят от номера долин, так что сами эти времена междолинных переходов зависят только от вида внутридолинного распределения $f_{j p_j}$, т. е. от разогрева носителей в долине, из которой совершается переход: $\tau_{j'} = \tau_j$. Система уравнений (14) при этом решается аналитически, и для поляризуемостей (18) ($\bar{y}_j \equiv v_j$) получаем

$$\chi_j^{\text{eq}} = \left[v_j + \left(\sum_{j'} v_{j'} / \tau_{j'} b_{j'} \right) \right] / \left(1 - \sum_{j''} 1 / \tau_{j''} b_{j''} \right) b_j, \quad (22)$$

где v_j определено выражением (19), в котором, однако, ввиду эквивалентности долин величину $\frac{\partial \omega_{j'j}}{\partial E}$ следует полагать не зависящей от j' .

Соответствующим образом изменяются выражения для сечения рассеяния света, полученные в [17], а именно выражения (17) и (26) работы [17]: входящие туда поляризуемости должны вычисляться по формулам (18) и (22) настоящей работы.

Таким же способом для малосигнальной электропроводности многодолинного полупроводника получим

$$\begin{aligned} \sigma_{\alpha\beta}(\omega) &= \sum_j \sigma_{j\alpha\beta} + e \sum_{j, j'} V_{j\alpha} \bar{n}_j (-i\omega + s/\tau_j)^{-1} \frac{\partial \omega_{j'}}{\partial E} \times \\ &\times \left\{ \delta_{j j'} - \left[(-i\omega + s/\tau_{j'}) \sum_{j''} (-i\omega + s/\tau_{j''})^{-1} \right]^{-1} \right\}, \end{aligned} \quad (23)$$

где s — число долин,

$$\sigma_{j\alpha\beta} = -e^2 \bar{n}_j \sum_{p_j} v_{j\alpha} \sigma_{j p_j}^{-1} \frac{\partial f_{j p_j}}{\partial p_j} \quad (24)$$

— парциальная дифференциальная проводимость долины j .

4. Сечение рассеяния света в длинноволновом пределе

Используя полученные формулы, вычислим дифференциальное сечение рассеяния света электронно-дырочной плазмой (3) в длинноволновом низкочастотном пределе (13). В этом случае возмущение имеет вид $y_{k j k p_{j k}} \equiv v_{k j k}^* F_{k j k p_{j k}}$, так что $\sum_{p_{j k}} y_{k j k p_{j k}}$ не содержит малости по параметру

рам (9), (13). Поэтому в выражении (17) для \tilde{y}_{kj_k} следует отбросить как второе (по параметру $q\nu_{kj_k}\tau_{pj_k}$), так и третье (по параметру $\tau_{pj_k}/\tau_{kj'_k}\tau_{kj_k}$) слагаемые. В результате получаем

$$\frac{d\sigma}{d\vartheta d\omega} = A2 \operatorname{Re} \sum_{kj_k} \mu_{kj_k} \hat{B}_{kj_k}^{-1} \mu_{kj_k}^* \bar{N}_{kj_k}, \quad (25)$$

где μ_{kj_k} дается выражением (4), а поляризуемость $\chi_{kj_k}^{q\omega}$ — выражением (18).

При этом предполагается, помимо условий (9), (13), медленность процессов максвелловской релаксации по сравнению с внутридолинной релаксацией: $\tau_{pj_k} \ll \tau_{kj_k}^M$.

В случае эквивалентных долин получаем

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\vartheta d\omega} = A2 \operatorname{Re} \sum_{kj_k} & \left[|\mu_{kj_k}|^2 \bar{N}_{kj_k} / b_{kj_k} + \left(1 / \left(1 - \sum_{j''_k} 1/\tau_{kj''_k} b_{kj''_k} \right) \right) \times \right. \\ & \times \left(\mu_{kj_k} / b_{kj_k} \right) \sum_{j'_k} \mu_{kj'_k}^* \bar{N}_{kj'_k} / \tau_{kj'_k} b_{kj'_k} \left. \right], \end{aligned} \quad (26)$$

где входящие в определения величин μ_{kj_k} (4) поляризуемости долин даются выражением (22). Таким образом, учет зависимости междолинных вероятностей от внутридолинного квазимпульса не меняет функциональной зависимости сечения рассеяния света от «перенормированных обратных масс» μ_{kj_k} (ср. формулы (25) и (26) с формулами (17) и (26) работы [17] соответственно), меняя, однако, сами эти массы (см. формулы (4), (18)–(19)).

Выражения (25) и (26) содержат как рассеяние на неэкранированных флюктуациях, связанных с пространственным перераспределением носителей, принадлежащих разным долинам, так и на флюктуациях плотности носителей в электронно-дырочной плазме. Вклад последних в случае изотропных масс рассмотрим в следующем разделе.

5. Простые энергетические зоны

В случае простых зон (т. е. скалярных масс) формула (26) дает

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\vartheta d\omega} = A \frac{q^2}{\Delta_{q\omega}} & \left\{ \overline{g_a g_a} \left(\frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_h} \right)^2 + \right. \\ & + \frac{2\bar{N}_e D_e \tau_M^2}{m_e} \left[\frac{2q^2 D_h}{\tau_h^M} \left(\frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_h} \right) + \frac{1}{m_e} ((q^2 D_h)^2 + \right. \\ & \left. \left. + (\omega - qV_h)^2) \right] + (e \leftrightarrow h) \right\}. \end{aligned} \quad (27)$$

В (27) использовано обозначение

$$\overline{g_a g_a} = [\bar{N}_e D_e (\tau_e^M)^2 + \bar{N}_h D_h (\tau_h^M)^2] / (\tau_e^M + \tau_h^M)^2 \quad (28)$$

для выражения, являющегося (при ланжевеновском подходе) коррелятором амбиполярных случайных сторонних потоков (ср. § (11) в [21]). Далее

$$\Delta_{q\omega} \equiv |\Omega_e \Omega_h \tau_M + \Omega_a|^2, \quad \Omega_m \equiv -i(\omega - qV_m) + q^2 D_m, \quad m = e, h, a, \quad (29)$$

индексом «*a*» обозначены амбиполярные скорость дрейфа и коэффициент диффузии

$$qV_a = q \frac{V_e \tau_e^M + V_h \tau_h^M}{\tau_e^M + \tau_h^M}, \quad D_a = \frac{D_e \tau_e^M + D_h \tau_h^M}{\tau_e^M + \tau_h^M}. \quad (30)$$

В условиях квазинейтральности, когда

$$q^2 D_k \tau_M \ll 1, \quad qV_k \tau_M \ll 1, \quad (31)$$

свет в основном рассеивается на квазинейтральных флюктуациях плотности носителей и в спектре рассеянного света выделяется пик, сдвинутый относительно начальной частоты на qV_a

$$\frac{d\sigma}{d\vartheta d\omega} = A \left(\frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_h} \right)^2 \frac{2g_a g_a}{(\omega - qV_a)^2 + [q^2(D_a + D_v)]^2}, \quad \omega \ll 1. \quad (32)$$

Ширина этого дошпер-сдвинутого в условиях дрейфа носителей лоренциана определяется полным коэффициентом амбиполярной диффузии $D_a + D_v$. Здесь

$$D_v \equiv [q(V_h - V_e)/q]^2 \tau_M^3 / \tau_e^M \tau_h^M \quad (33)$$

— коэффициент конвективной амбиполярной диффузии [11, 12], приводящий к более эффективному рассасыванию квазинейтральных флюктуаций плотности носителей вдоль направления $V_h - V_e$. В то же время, как видно из (32), (28), этот конвективно-полевой процесс не влияет на зарождение флюктуаций плотности носителей, которое определяется только стохастическими процессами в электронно-дырочной плазме, тогда как конвективно-полевой процесс таковым не является. Отношение дополнительного уширения $q^2 D_v$ к амбиполярно-диффузионной ширине $q^2 D_a$ имеет порядок $\{q(V_h - V_e)/q\}^2 \tau_M^3 / \tau_k^2 \tau_p$. Это отношение может не быть малым даже в слабо-неравновесных условиях [11, 12].

Обратим внимание на то обстоятельство, что на основе уравнений для одновременных корреляторов в условиях квазинейтральности (31) получается следующее выражение для интегральной интенсивности рассеянного электронно-дырочной плазмой света:

$$\begin{aligned} d\sigma/d\vartheta = 2\pi A & \{ \overline{g_a g_a} (1/m_e + 1/m_h)^2 + [\bar{N}_e (D_h \tau_M + D_v \tau_e^M (1 + q^2 D_h^* \tau_h^M)) \times \\ & \times q^2 D_e / m_e^2 + (e \leftrightarrow h)] \} / (D_a + D_v). \end{aligned} \quad (34)$$

Первое слагаемое в фигурных скобках — это интегральная интенсивность центрального лоренциана (32), второе — это интенсивность низкого, но широкого плато в спектре рассеянного света, простирающегося до $\omega \sim 1/\tau_M$ (см. (27)). Эта часть спектра по интенсивности отнюдь не всегда сравнима с центральным лоренцианом, однако в условиях преобладания одного сорта носителей эти интенсивности по порядку величины сравниваются (например, при $\bar{N}_e \gg \bar{N}_h$, $\tau_h^M \gg \tau_e^M$, в (34) во втором слагаемом остается явно выписанные в (34) выражения). Эта особенность рассеяния квазинейтральной электронно-дырочной плазмой обсуждалась применительно к равновесию в [21].

6. Сложные [энергетические] зоны

Как видно из (25)–(26), многодолинность усложняет спектр рассеянного света, делая его в случае произвольной геометрии трудно интерпретируемым. Однако геометрию опыта можно подобрать таким образом, чтобы рассеяние на неэкранированных междолинных флюктуациях и на амбиполярных флюктуациях разделилось.

Рассмотрим случай эквивалентных долин, причем как вектор q , так и поле E направим симметрично относительно долин, чтобы долины грелись одинаково и кинетические коэффициенты в долинах не зависели от индекса долин j_k (для эквивалентных долин одновременно в зоне проводимости и в валентной зоне такая геометрия осуществима, например, в халькогенидах свинца). Из (26) получаем при этом

$$\frac{d^2\sigma}{d\vartheta d\omega} = \sum_k \left(\frac{d^2\sigma}{d\vartheta d\omega} \right)_k^I + \left(\frac{d^2\sigma}{d\vartheta d\omega} \right)_{II}, \quad (35)$$

$$\left(\frac{d^2\sigma}{d\vartheta d\omega} \right)_k^I = 2A \frac{\bar{N}_k}{s_k} \sum_{jk} \left[\left(\frac{1}{m_k} \right)_{jk} - \right. \\ \left. - \frac{1}{m_k} \right]^2 \frac{q^2 D_k + s_k/\tau_k}{(\omega - qV_k)^2 + (q^2 D_k + s_k/\tau_k)^2}, \quad (36)$$

тогда как $(d\sigma/d\vartheta d\omega)_{II}$ дается выражением (27), где под $1/m_k$ следует подразумевать усредненную по долинам величину

$$1/m_k = (1/\bullet_k) \sum_{jk} (1/m_k)_{jk}. \quad (37)$$

Таким образом, в рассматриваемой геометрии сечение рассеяния света разбивается на две части. Первая из них — это рассеяние на нейтральных флюктуациях носителей одного сорта, при которых соблюдается условие $\sum_{jk} \delta n_{kj} = 0$, т. е. в каждой точке пространства полная концентрация частиц данного сорта не меняется. Локально флюктуирует только заселенность отдельных долин, приводя к рассеянию света на «флюктуациях массы», характерных и для многодолинного полупроводника с одним сортом носителей [17]. Второе слагаемое описывает рассеяние света на флюктуациях плотностей зарядов разных знаков. В частности, в условиях квазинейтральности (31) полный заряд не флюктуирует $\sum_k e_k \delta n_k = 0$ и рассеяние происходит на нейтральных флюктуациях электронно-дырочной плазмы. Итак, свет рассеивается на двух типах неэкранированных флюктуаций, причем оба вклада в рассеяние света растут с ростом концентраций носителей. Рассеяние на первом типе сильно зависит от ориентации векторов поляризации света ε_z и ε_s относительно главных осей эллипсоидов. Эти особенности должны помочь при анализе спектра рассеянного столкновительной электронно-дырочной плазмой света, в том числе дать возможность определить как амбиполярный, так и внутридолинные монополярные коэффициенты диффузии.

Список литературы

- [1] Платцман Ф., Вольф М. Волны в плазме твердого тела. М., 1975. 438 с.
- [2] Клейн М. В. Рассеяние света в твердых телах. М., 1979. С. 174—238.
- [3] Abstreiter G., Cardona M., Pinczuk A. // Light scattering in solids IV. Berlin Heidelberg, 1984. Р. 5—150.
- [4] Pinczuk A., Shah J., Wolf P. A. // Phys. Rev. Lett. 1981. V. 47. N 20. P. 1487—1490.
- [5] Chandrasekhar M., Cardona M., Kane E. O. // Phys. Rev. B. 1977. V. 16. N 8. P. 3579—3595.
- [6] Iratova I. P., Subashiev A. V., Voitenko V. A. // Sol. St. Comm. 1981. V. 37. N 8. P. 893—895.
- [7] Акатор Л. Л., Ганцевич С. В., Катилюс Р., Рысаков В. М. // Письма в ЖЭТФ. 1978. Т. 27. № 11. С. 633—636.
- [8] Акатор Л. Л., Ганцевич С. В., Катилюс Р., Рысаков В. М. // Тез. докл. II конф. «Флюктуационные явления в физических системах». Вильнюс, 1979. С. 34—35.
- [9] Contreras G., Sood K., Cardona M. // Phys. Rev. B. 1985. V. 32. N 2. P. 924—929.
- [10] Mestres N., Cardona M. // Phys. Rev. Lett. 1985. V. 55. N 10. P. 1132—1135.
- [11] Gelmont B. L., Shur M. S. // Phys. Lett. A. 1971. V. 35. N 5. P. 353—354.
- [12] Барейкис В., Баркаускас Р., Катилюс Р. // Лит. физ. сб. 1988. Т. 28. № 6. С. 686—692.
- [13] Platzman P. M. // Phys. Rev. A. 1965. V. 139. P. 379—387.
- [14] McWhorter A. L. Physics of Quantum Electronics. N. Y., 1966. P. 111.
- [15] Gantsevich S. V., Gurevich V. L., Kagan V. D., Katilius R. // Light scattering in solids / Ed. M. Balkanski. Flammarion, Paris, 1971. P. 94—97.
- [16] Ганцевич С. В., Катилюс Р., Устинов Н. Г. // ФТТ. 1974. Т. 16. № 4. С. 1106—1113.

- [17] Ганцевич С. В., Катилюс Р., Устинов Н. Г. // ФТТ. 1974. Т. 16. № 4. С. 1114—1121.
- [18] Gantsevich S. V., Gurevich V. L., Katilius R. // Riv. Nuovo Cim. 1979. V. 2. N 5. P. 1—87.
- [19] Ridley B. K., Watkins T. B. // J. Phys. Chem. Sol. 1961. V. 22. P. 155.
- [20] Аронов А. Г., Ивченко Е. Л. // ФТТ. 1971. Т. 13. № 9. С. 2550—2557.
- [21] Баркаускас Р., Ганцевич С. В., Катилюс Р. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 10. С. 3030—3035.

Институт физики
полупроводников АН ЛитССР
Вильнюс

Поступило в Редакцию
11 мая 1989 г.
